

1. Record Nr.	UNISANNIONAP0472458	
Autore	Bowen, David Keith <1940- >	
Titolo	X-ray metrology in semiconductor manufacturing / D. Keith Bowen, Brian K. Tanner	
Pubbl/distr/stampa	Boca Raton [etc.], : CRC, : Taylor & Francis, 2006	
ISBN	0849339286	
Descrizione fisica	279 p. : ill. ; 25 cm.	
Altri autori (Persone)	Tanner, Brian K.	
Disciplina	621.3815 621.38152	
Soggetti	Semiconduttori Raggi X - Diffrazione	
Collocazione	SALA DING 621.3815	BOW.xr
Lingua di pubblicazione	Inglese	
Formato	Materiale a stampa	
Livello bibliografico	Monografia	